

emv

Internationale Fachmesse und Kongress
für Elektromagnetische Verträglichkeit
International Exhibition and Conference
on Electromagnetic Compatibility (EMC)

Forenprogramm / *Forum program*

Täglich / *Daily*

Dienstag – Donnerstag / *Tuesday – Thursday*

20. – 22.02.2018 / *20 – 22 February 2018*

Stand 3-116 / *Booth 3-116*

mesago

Messe Frankfurt Group

Forum Halle 3, Stand 3-116

Forum hall 3, booth 3-116

Dienstag, 20.02.2018 *Tuesday, 20 February 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>	
10:40 - 11:00	Langer EMV-Technik GmbH	Jörg Hacker	Entwicklungsbegleitend Störaussendung messen - Effektive Suche nach Störquellen auf der Baugruppe -	
11:00 - 11:20	AMETEK CTS Europe GmbH	Thomas Handschin	Ein System – mehrere Anwendungen: Testlösung für Elektrofahrzeuge gemäss ECE R10 Rev.05 und LV123	
11:20 - 11:40	Alice Messtechnik GmbH	Ulrich Oberhaus	Die smarte Art Störern auf die Spur zu kommen: aktive Nahfeld-Sonden	
11:40 - 12:00	emv Service GmbH	Werner Ratzel	DAkKS konforme Verifizierung von Breitband-Leistungsverstärkern	
12:00 - 12:20	TESEO S.p.A	Werner Ratzel	Elektrische Signale störungsfrei und EMV-konform übertragen	
12:20 - 12:40	AR Deutschland GmbH	Jörg Voss	U-Series Broadband Power Amplifier 10kHz-1GHz	
12:40 - 13:00	ETS Lindgren	Ammar Sarwar	Automated Equipment Under Test (EUT) Vision System Monitoring for Immunity Testing	EN
13:00 - 13:20	Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG	Stefan Stahuber	Conducted and Radiated Emission Measurement during Product Development and Verification	EN
13:30 - 14:30	Plenarvortrag in Saal X – Plenary Speech in room X „Virtuelle Akustik in Augmented und Mixed Reality“ Referent: Prof. Dr. Jürgen Karl Peissig, Institut für Kommunikationstechnik, Leibniz Universität Hannover			
14:40 - 15:00	CST-Computer Simulation Technology GmbH	Timo Baruth	Bulk Current Injection (BCI) Simulation	
15:00 - 15:20	EM Consulting and Software Europe GmbH	Anna Gheonjian	3D PEEC Solution for Power Electronics Applications	EN
15:20 - 15:40	SIEPEL SAS	Jos Westhof-Jacobs	Mode Stirred Reverberating Chambers - Features, Functions, Benefits	EN
15:40 - 16:00	Frankonia Germany EMC Solutions GmbH	Daniel Feyerlein	FRANKONIA Absorberhallen: Vorstellung neuer Absorberhallen und Absorbertechnologie	
16:00 - 16:20	NEXIO SAS	Olivier Roffe	BAT-Manager	EN

 English speaking

Änderungen vorbehalten/Subject to change





Mittwoch, 21.02.2018 *Wednesday, 21 February 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>	
09:40 - 10:00	MRC Gigacom / Wavecontrol	Christophe Capitaine	New Portable Test Equipment For Human Exposure To Electromagnetic Fields	EN
10:00 - 10:20	AR Deutschland GmbH	Steven Bertsch	Audio- Breitband Standard Wellenformgenerator	
10:20 - 10:40	Durferrit GmbH	Jochen Baumhauer	PROCEM™ a metallic coating for electromagnetic shielding	EN
10:40 - 11:00	Prâna Recherche & Developement Sarl	Abdesslem Haddouti	New developments & benefits of Prâna amplifiers	EN
11:00 - 11:20	Altair Engineering GmbH	Sandra Fermiñán Rodríguez	FEKO - A Comprehensive Solution for EMC Analysis	EN
11:20 - 11:40	Frankonia Germany EMC Solutions GmbH	Daniel Feyerlein	FRANKONIA Absorberhallen: Vorstellung realisierter Individuallösungen sowie Ausblick E-Drive Prüfstände	
11:40 - 12:00	Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG	Michael Hempel	Tunable Amplifier for Automotive EMC	
12:00 - 12:20	SOLIANI EMC S.r.l.	Alessandro Soliani Brivio	Electrically conductive fabrics for EMI EMC Shielding solutions	EN
12:20 - 12:40	DARE!! INSTRUMENTS	Patrick Dijkstra	Wideband Laser E-field probe with highest overall accuracy	EN
12:40 - 13:00	EMC Test NRW GmbH	Christoph Schmidt	CE goes Automotive – EMV-Qualifizierung von Industrie-Komponenten für den Fahrzeugbereich	
13:00 - 14:30	Kompaktseminar – Compact seminar – „Wireless EMC“ ETS-Lindgren 13:00 - 13:45 - Testing Challenges of Smart Antenna Systems for 5G and Millimeter Waves - Michael Foegelle 13:45 - 14:35 - The Impact of Antennas and Sensors on Automotive EMC - Garth D'Abreu			EN
14:40 - 15:00	GAUSS INSTRUMENTS	Stephan Braun	Der neue Messempfänger – the new benchmark in EMC testing	
15:00 - 15:20	EMCO ELEKTRONIK GmbH	Diego Waser	EMV-Messempfänger - Auswahl nach technischen und ökonomischen Gesichtspunkten	
15:20 - 15:40	CE-SYS Engineering GmbH	Georg Hesse	Automatisierte visuelle Prüfungsüberwachung im emv-Labor	
15:40 - 16:00	LGAI Technological Center S.A. Applus + Laboratories	Jose María Laborda	Optimisation of ALSE Radar Immunity test method for automotive parts testing	EN
16:00 - 16:20	EMI Solutions PVT. Ltd.	Aswin R.	Point of Entry Protection (POE) Using Hemp Power Line and Service Line Filters - New Developments	EN
16:20 - 16:40	AMETEK CTS Europe GmbH	Markus Fuhrer	Der neue Maßstab für Multifunktionsgeneratoren gemäss IEC 61000-4-x und ANSI/IEEE C62.41 bis 7kV	

Forum Halle 3, Stand 3-116

Forum hall 3, booth 3-116

Donnerstag, 22.02.2018 *Thursday, 22 February 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
09:40 - 10:00	EMC Test NRW GmbH	Pascal Betz	Typgenehmigung von Verbrennungs- und Elektrofahrzeugen – Verfahren, Prüfgrundlage und Prüfumfang
10:00 - 10:20	ETS Lindgren	Vic Hudson	Turnkey EMC Test System Advantages 
10:20 - 10:40	Langer EMV-Technik GmbH	Sven König	ESD - Schwachstellen von ICs und Elektronik aufspüren
10:40 - 11:00	Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG	Alexander Scholl	R&S@TS8997 - Ready for RED 
11:00 - 12:00	Kompaktseminar – Compact seminar When Black Magic Disappears: EMI and Solutions Ismael Molina Alba - Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Co-Referent: Lee Hill - SILENT Solutions LLC & GmbH 		
12:00 - 12:20	GAUSS INSTRUMENTS	Stephan Braun	Anforderungen bei Funkmessungen und deren Umsetzung
12:20 - 12:40	DARE!! INSTRUMENTS	Edwin vom Hofe	Innovative Active Antenna Array for lossless E-field generation 
12:40 - 13:00	SGS Germany GmbH	Josef Bauer	Neue EMV-Anforderungen für Medizinprodukte nach 4. Edition der EN 60601-1-2
12:40 - 13:00	Feuerherdt GmbH	Doris Hünerfauth	EMV-Abschirmungen – eine Übersicht
14:30	Verleihung Best Paper und Young Engineer Award Best Paper and Young Engineer Award		

 English speaking

Änderungen vorbehalten/Subject to change